

应用笔记

N32G43x系列安全启动应用笔记

简介

安全在电子应用领域起着越来越重要的作用。在电子设计中，组件的安全要求水平不断上升，电子设备制造商将很多新技术解决方案纳入了新组件设计。用于提高安全的软件技术不断涌现。硬件和软件的安全要求相关标准也在持续开发中。

本文档介绍了该工程在 N32G43x 的 MCU 中如何执行 IEC 60730 所要求的软件安全性相关的操作及相关应用代码内容。

本文档适用于国民技术的 N32G43x 系列产品。

国民技术 版权所有

目录

1. IEC60730 class B 软件标准介绍.....	1
2. 测试点流程说明	1
2.1 启动时检测流程.....	3
2.1.1 CPU 启动时检测.....	3
2.1.2 看门狗启动时检测.....	4
2.1.3 FLASH 启动时检测.....	5
2.1.4 RAM 启动时检测	9
2.1.5 时钟启动时检测.....	10
2.1.6 控制流启动时检测.....	12
2.2 运行时检测流程.....	12
2.2.1 CPU 运行时检测.....	12
2.2.2 堆栈边界运行时溢出检测.....	13
2.2.3 系统时钟运行时检测.....	14
2.2.4 FLASH 运行时检测	15
2.2.5 看门狗运行时检测.....	16
2.2.6 局部 RAM 运行时自检	16
3. 软件库移植要点	18
4. 历史版本	19
5. 声 明	20

1. IEC60730 class B 软件标准介绍

为确保电器使用安全，需要对软件运行时的风险控制措施进行评估。

国际电工委员会颁布的 IEC60730 引入了家用电器软件评估要求，附录 H(H.2.21)中对软件进行了分类：

A 类软件：软件仅实现产品的功能，不涉及产品的安全控制。比如室用恒温器的软件，灯光控制的软件...

B 类软件：软件的设计要防止电子设备的不安全操作。例如带自动门锁控制的洗衣机软件，带过热控制的电磁炉软件...

C 类软件：软件的设计为了避免某些特殊的危险。例如自动燃烧器控制和封闭的热水器的热切断（主要针对一些会引起爆炸的设备）

其中 B 类软件的具体评估要求，包含了需要检测的组件及相关故障和测试方案，整理见下表（参考 IEC60730 表 H.11.12.7）：

需要检测的组件		故障/错误	故障分类	nations 提供库	测试方案概述
1.CPU	1.1 寄存器	滞位(Stuck at)	MCU 相关	是	写相关寄存器并检查
	1.3 程序计数器	滞位(Stuck at)	MCU 相关	是	PC 跑飞则启动看门狗复位
2.中断		没有中断或者中断太频繁	应用相关	否	计算进中断次数
3.时钟		错误的频率	MCU 相关	是	使用 HSI 测 HSE 时钟频率
4.存储器	4.1 非易失存储器	所有的单比特错误	MCU 相关	是	FLASH CRC 完整性校验
	4.2 易失存储器	DC fault	MCU 相关	是	1. SRAM March C测试 2. 堆栈溢出检测
	4.3 寻址（与非易失和易失存储器相关）	滞位(Stuck at)	MCU 相关	是	FLASH/SRAM 测试已包含
5.内部数据 路径	5.1 数据	滞位(Stuck at)	MCU 相关	否	仅针对使用外部存储器的 MCU，单片 MCU 不要求
	5.2 寻址	错误的地址	MCU 相关	否	
6.外部通信	6.1 数据	汉明距离 3	应用相关	否	数据传输中增加校验
	6.2 寻址	错误的地址	应用相关	否	
	6.3 时序	错误的时序	应用相关	否	计算通信事件的次数
7.输入输出	7.1 数字 I/O	H27 中定义的错误	应用相关	否	无
	7.2 模拟输入输出	H27 中定义的错误	应用相关	否	无

2. 测试点流程说明

Class B软件包程序检测内容分为两个主要部分：启动时的自检和运行时的周期自检。启动时的自检包括：

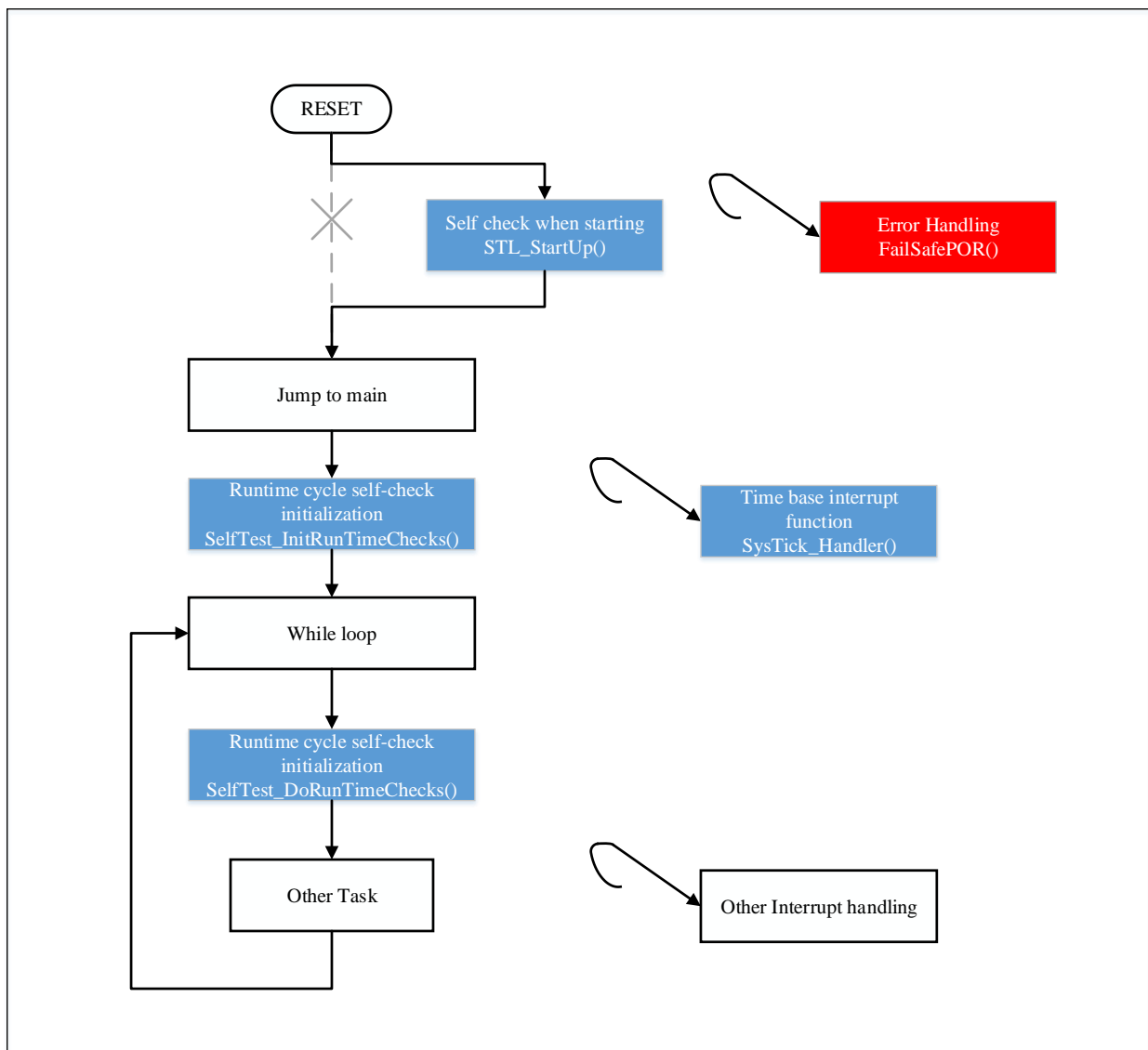
- CPU检测
- 看门狗检测

- Flash完整性检测
- RAM功能检测
- 系统时钟检测
- 控制流检测

运行时的周期自检：

- 局部CPU内核寄存器检测
- 堆栈边界溢出检测
- 系统时钟运行检测
- Flash CRC分段检测
- 看门狗检测
- 局部RAM自检(在中断服务程序中进行)

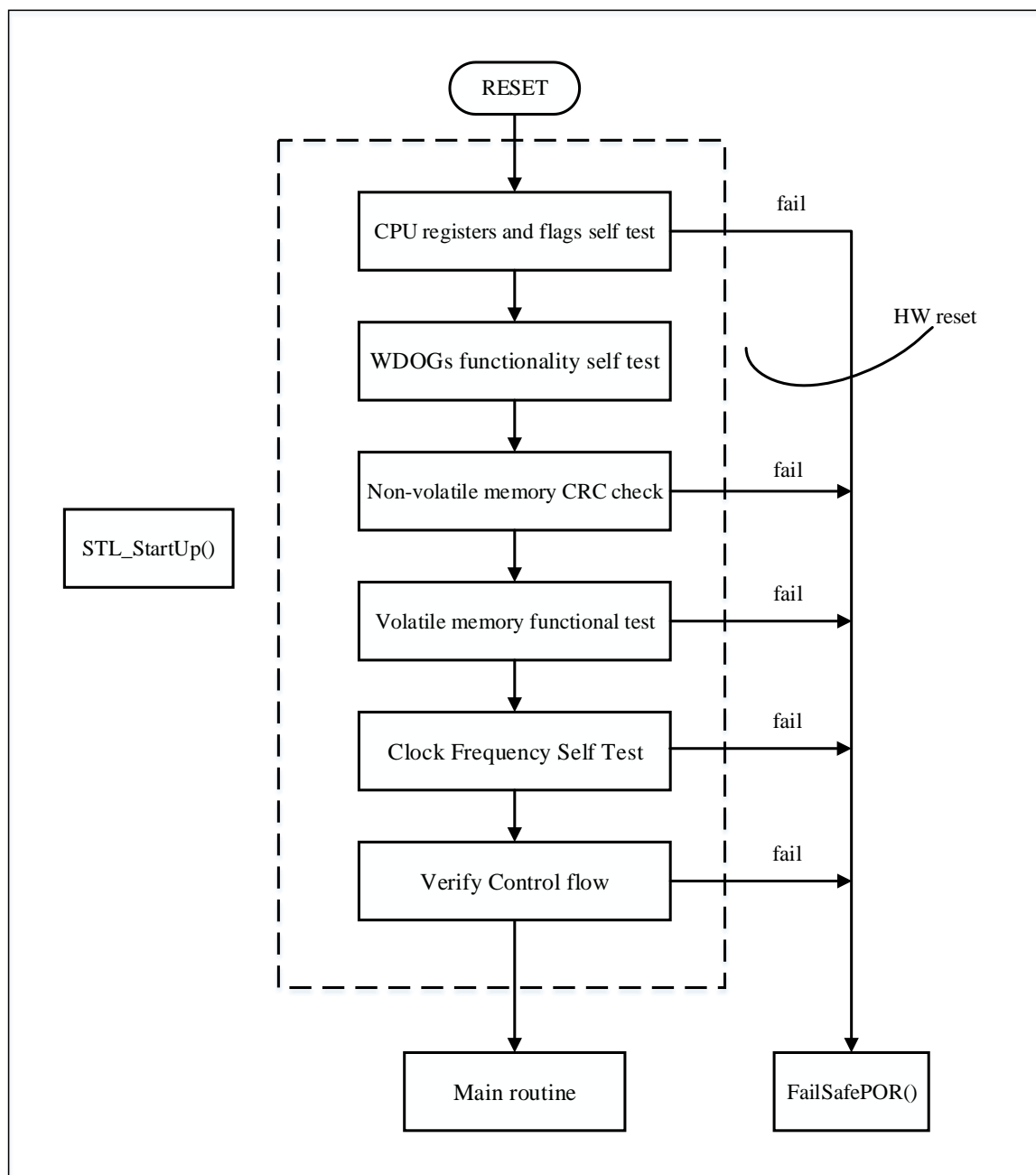
总体流程框图如下：



2.1 启动时检测流程

在芯片由启动到进入main函数之前，先进行启动检测，修改启动文件来执行该部分代码，检测流程结束后调用__iar_program_start函数跳转回main函数。

下图是执行启动时自检的流程框图：



2.1.1 CPU 启动时检测

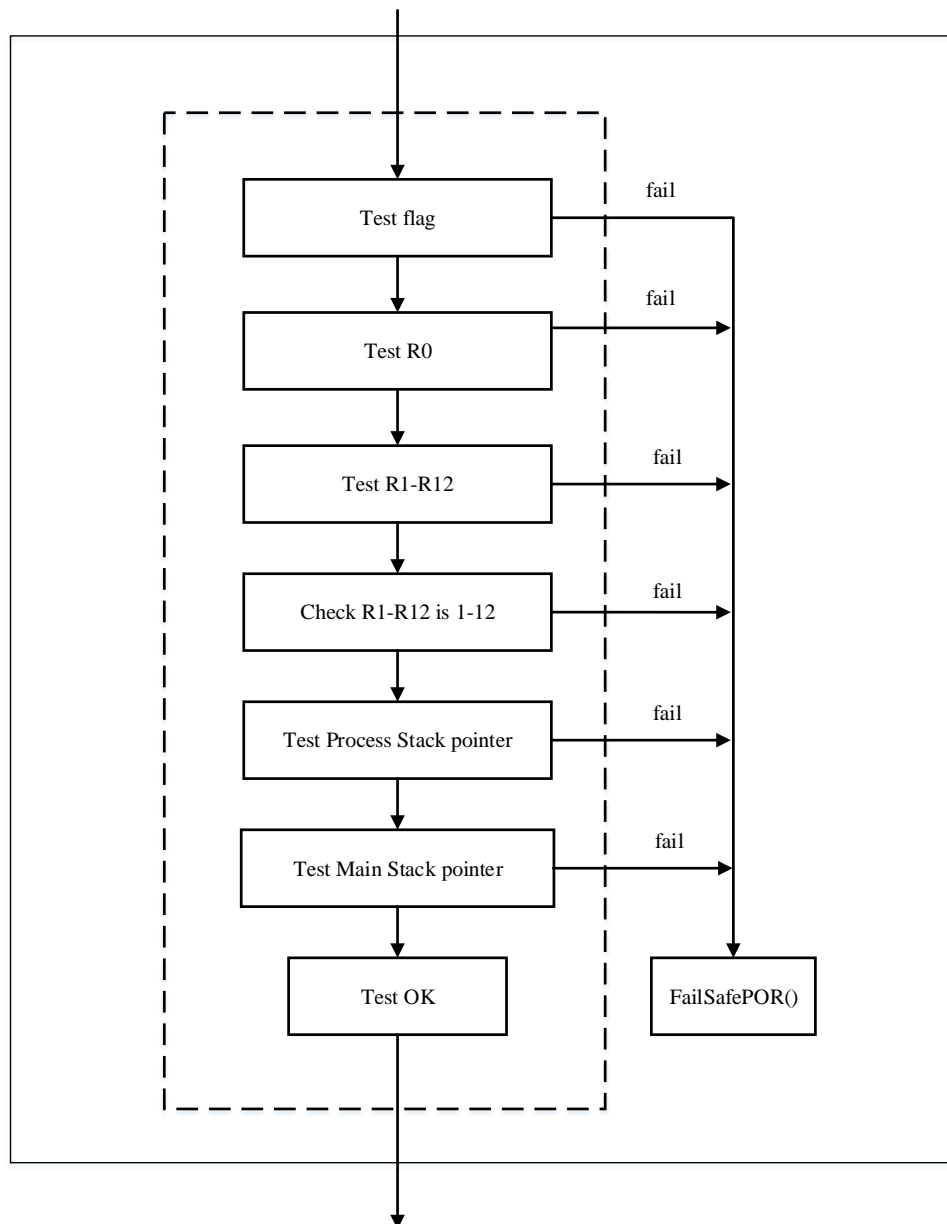
CPU自检主要检查内核标志、寄存器等是否正确。如果发生错误，就会调用故障安全处理函数FailSafePOR ()。

CPU自检在启动时和运行时都会进行，在启动时，R0~R12、PSP、MSP寄存器和

Z(zero)、N(negative)、C(carry)、V(overflow)标志位的功能测试都会进行一次自检；运行时，周期性自检，仅检测寄存器R1~R12。

寄存器检测具体实现方式为：分别往寄存器中写入 0xAAAAAAAA 和 0x55555555，再进行比较读取值是否为写入的值。R1 测试完后写 1，R2 测试完后写 2，以此类推。

标志位检测具体实现方式为：分别使标志位置位，若检查标志位错误则进故障函数。检测流程框图如下：



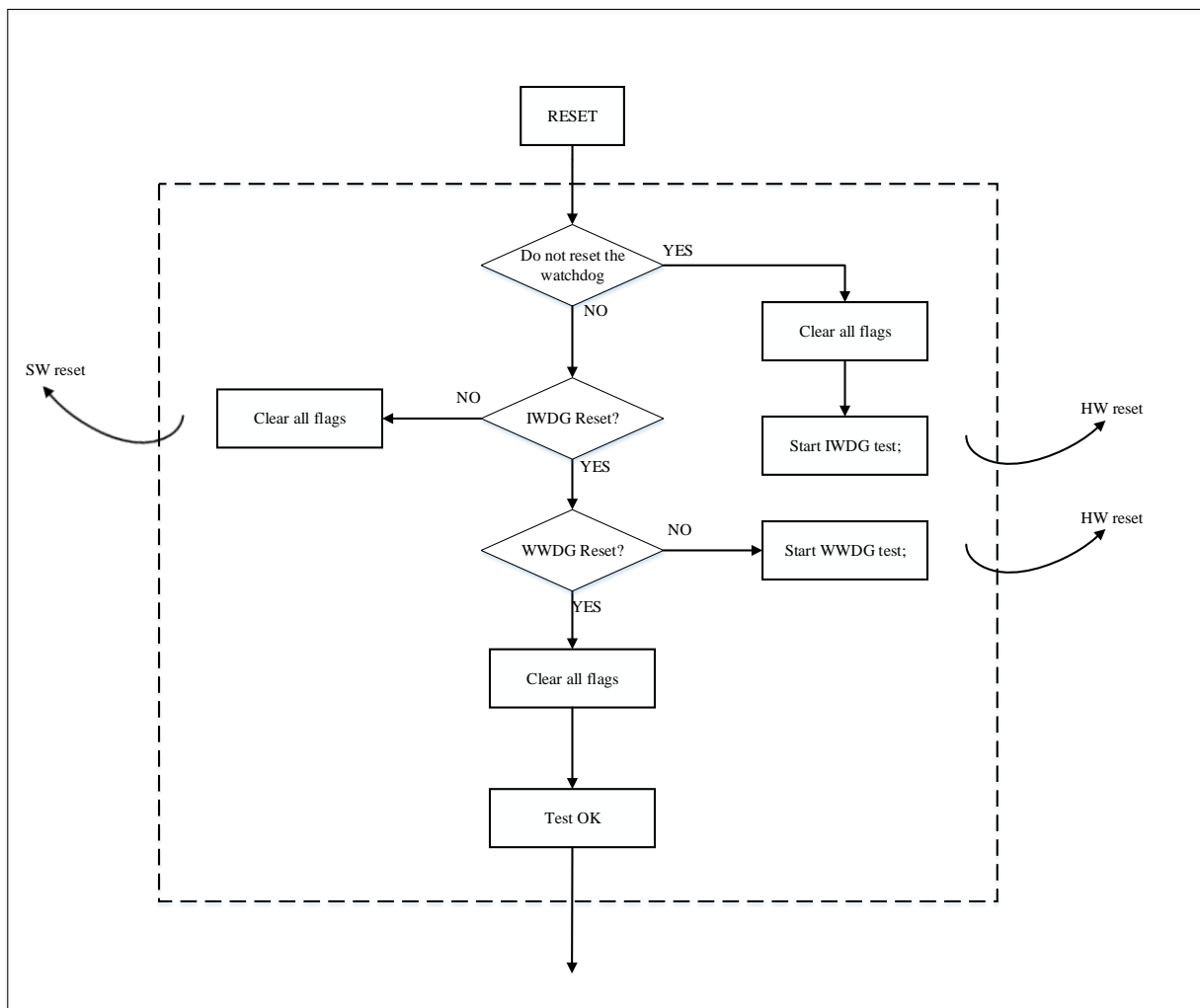
2.1.2 看门狗启动时检测

测试确认独立看门狗及窗口看门狗能正确复位，以确保在程序运行时跑飞能及时复位防止卡死。

初次复位后清除所有复位状态寄存器标志位，启动 IWDG 测试，使芯片复位，判断是否为 IWDG 复位标志位；置起则启动 WWDG 测试，使芯片复位，判断为 WWDG 复位标

志位置起则看门狗测试通过，清除所有标志位。

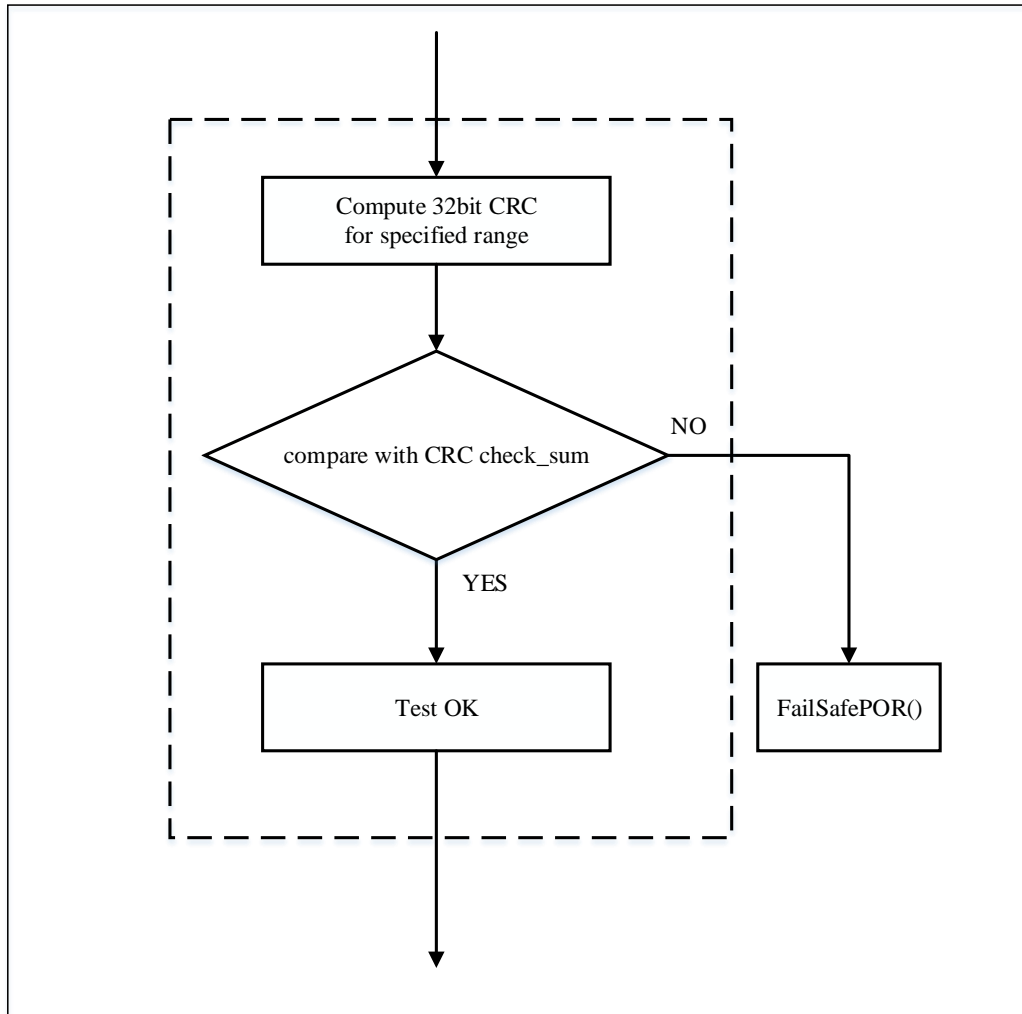
流程框图如下：



2.1.3 FLASH 启动时检测

FLASH自检是程序中将flash数据用CRC算法计算，将结果值跟编译时计算好并且存储在FLASH指定位置的CRC值进行比较，以此确认FLASH完整性。

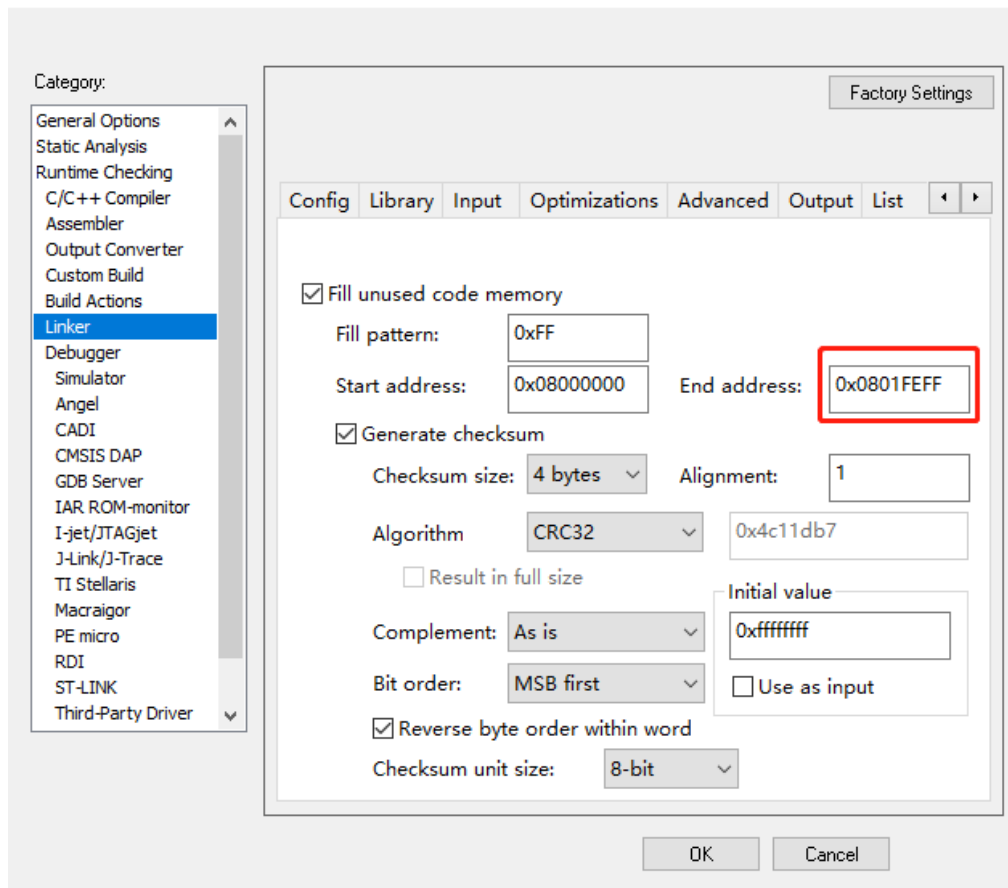
流程框图如下：



其中CRC计算的FLASH范围根据整个程序的实际情况进行配置，方法在KEIL和IAR上有所不同。

IAR配置：

IAR配置选项中支持CRC计算，只需要配置好参数，编译生成的文件就会自动将CRC check_sum值添加到选定FLASH计算范围后面：



程序中计算CRC的范围根据.icf文件配置，可根据需求修改，在以上配置基础上加4：

```

record_crc32.bat  crc_load.ini  N32G43x.icf
/*###ICF### Section handled by ICF editor, don't touch! ****/
/*-Editor annotation file-*/
/* IcfEditorFile="$TOOLKIT_DIR$\config\ide\IcfEditor\cortex_v1_0.xml" */
/*-Specials-*/
define symbol __ICFEDIT_intvec_start__ = 0x08000000;
/*-Memory Regions-*/
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_start__ = 0x08000000;
define symbol __ICFEDIT_region_ROM_end__ = 0x0801FF03; /* Modify according to needs, Contains crc results */
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_start__ = 0x20000100;
define symbol __ICFEDIT_region_RAM_end__ = 0x20007FFF; /* Modify according to needs */

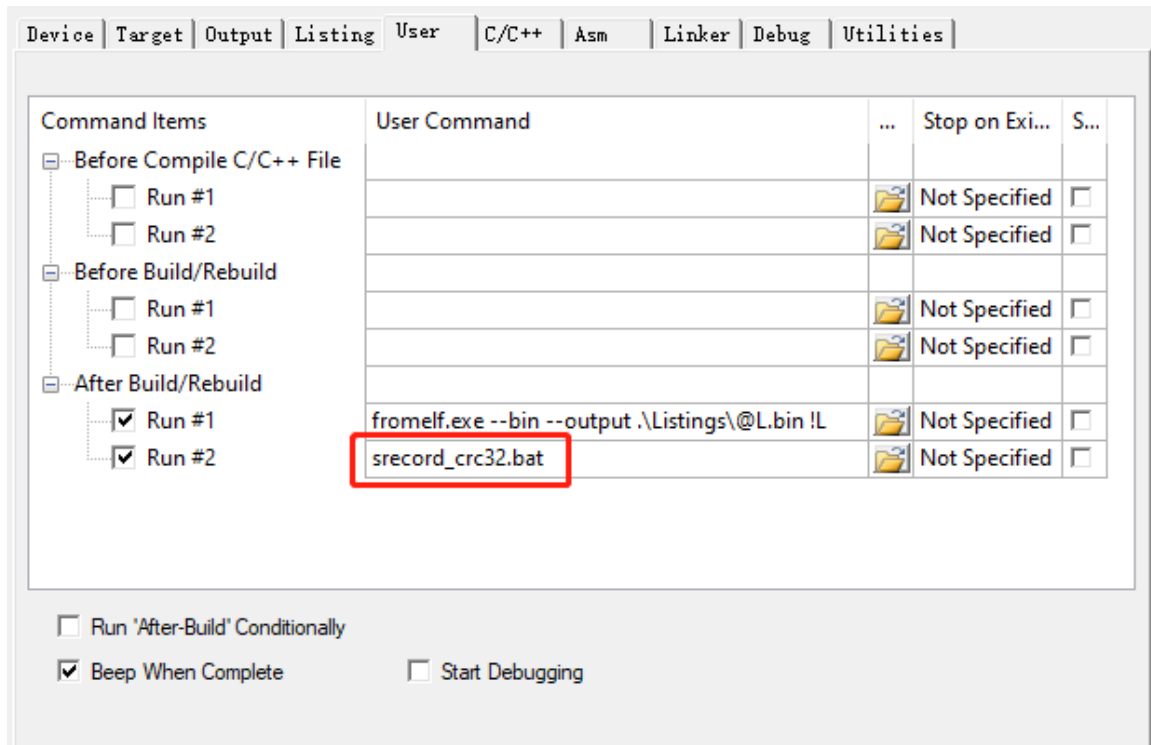
define symbol __ICFEDIT_region_CLASSB_start__ = 0x20000040;
define symbol __ICFEDIT_region_CLASSB_end__ = 0x20000100;

```

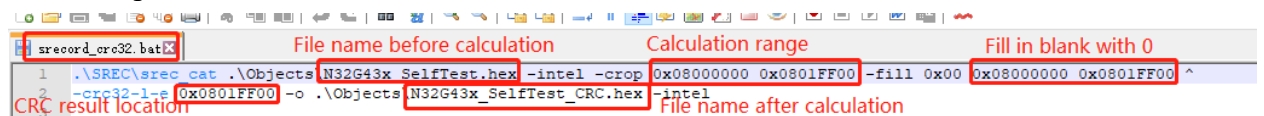
Keil配置：

Keil的配置较为复杂，ARM官方对于ROM Self-Test in MDK-ARM推荐使用第三方软件SRecord进行CRC测试。

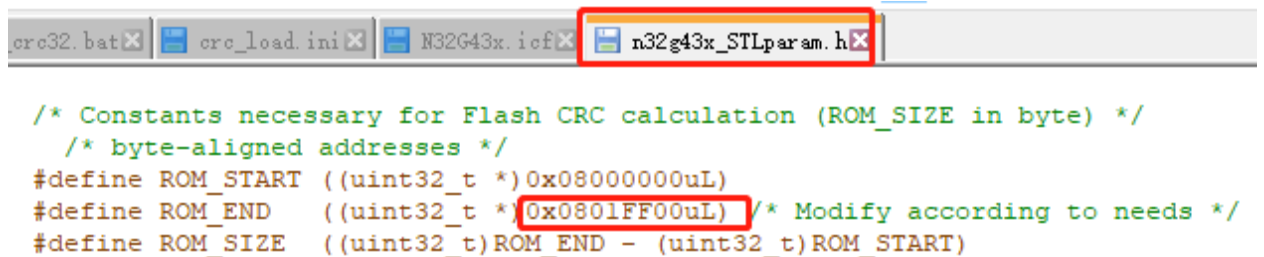
根据工程配置，编译完成后会调用脚本文件srecord_crc32.bat，通过srec_cat.exe软件，将Keil编译生成的N32G43x_SelfTest.hex文件中的数据进行CRC计算，生成CRC校验结果，添加到指定位置得到新的N32G43x_SelfTest_CRC.hex文件：



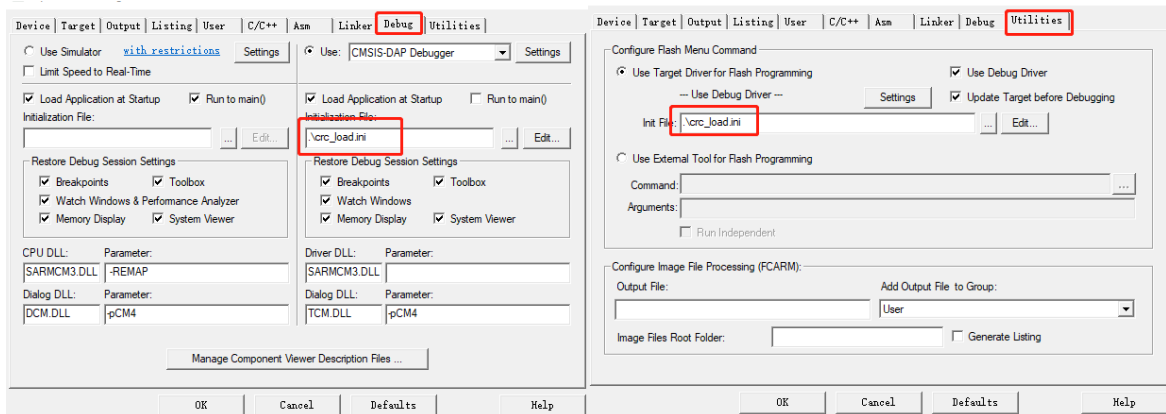
使用Notepad或其他工具打开.bat文件，根据实际应用修改以下内容：



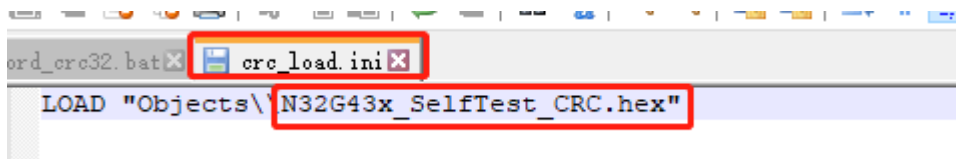
程序中计算CRC的范围根据n32g43x_STLparam.h文件配置，可根据需求修改，与以上配置保持一致：



因此不论是在下载还是调试时，都需要使用最终生成的N32G43x_SelfTest_CRC.hex文件，所以在Keil配置选项中需添加.ini文件用于下载新的.hex文件，配置如下：



需要注意，.ini文件也要根据实际应用修改内容文件名配置：



2.1.4 RAM 启动时检测

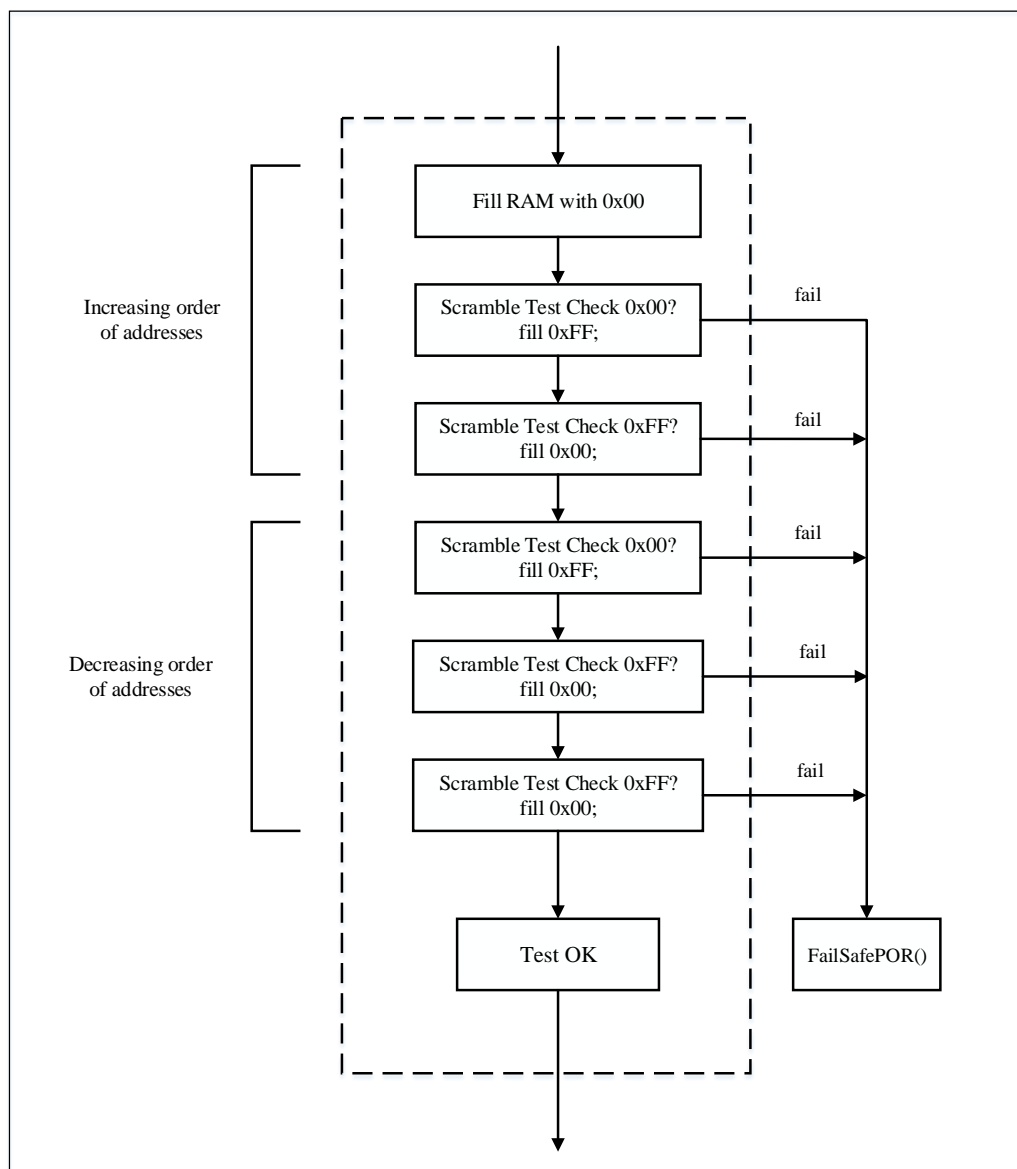
SRAM检测不仅检测数据区域的错误，还检测其内部地址和数据路径的错误。

SRAM自检采用March-C算法，March-C是一种用于嵌入式芯片SRAM测试的算法，是安全认证的一部分。启动时对SRAM所有范围进行检测。

首先将SRAM整片清零，然后按位逐位置1，每置一位，测试该位是不是1，是就继续，不是就报错；全部置完后，再逐位清0，每清一个位，测试该位清0是不是0，如果是就正确，不是就报错。直至完成整个RAM空间的测试

测试时分6个循环，用值0x00和0xFF逐字交替检查和填充整个RAM，前3个循环按照地址递增执行，后3个循环按照地址递减执行。

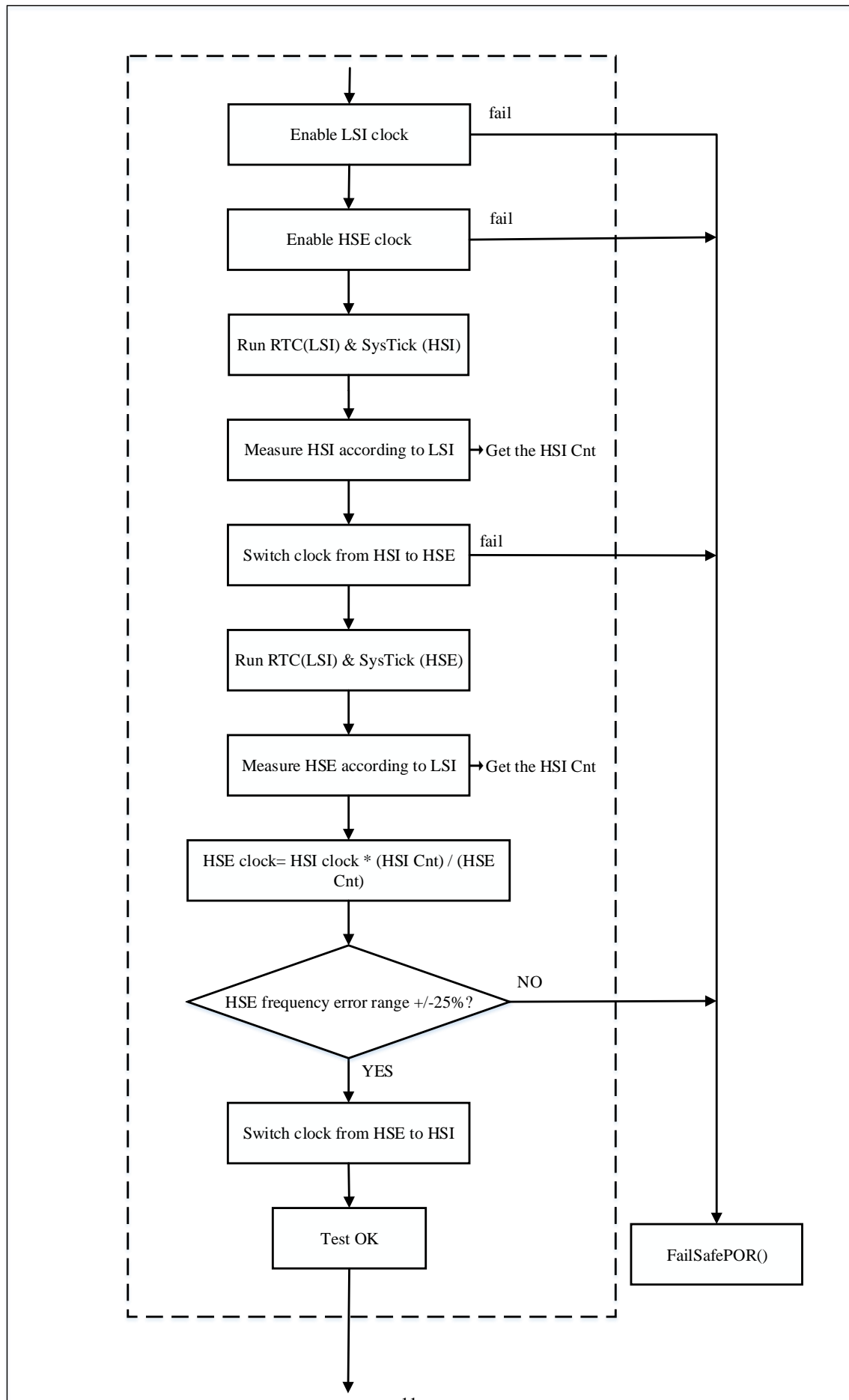
整个RAM检测算法流程如下图所示：



2.1.5 时钟启动时检测

测试原理如下：

- 1.启动外部高速时钟源（HSE）。
- 2.测试开始前系统时钟源默认配置为HSI，然后初始化RTC(时钟源为LSI)及Systick（时钟源为系统时钟），RTC与Systick同时开始运行，当Systick计数由重载值递减到0时记录当前RTC计数，得到HSI Cnt。
3. 切换系统时钟源配置为HSE，然后初始化RTC(时钟源为LSI)及Systick（时钟源为系统时钟），以同样方式得到HSE Cnt。
- 4.以HSI时钟频率为标准，根据如下流程图公式计算得出HSE频率，将该频率值与预期的范围值进行比较：如果超过 $\pm 25\%$ ，则测试失败。测试完后切换系统时钟源HSI，预期范围值可由用户自己根据实际应用情况调整，宏定义为HSE_LimitHigh()及HSE_LimitLow()。



2.1.6 控制流启动时检测

开机启动自检部分以控制流检测指针程序结束。

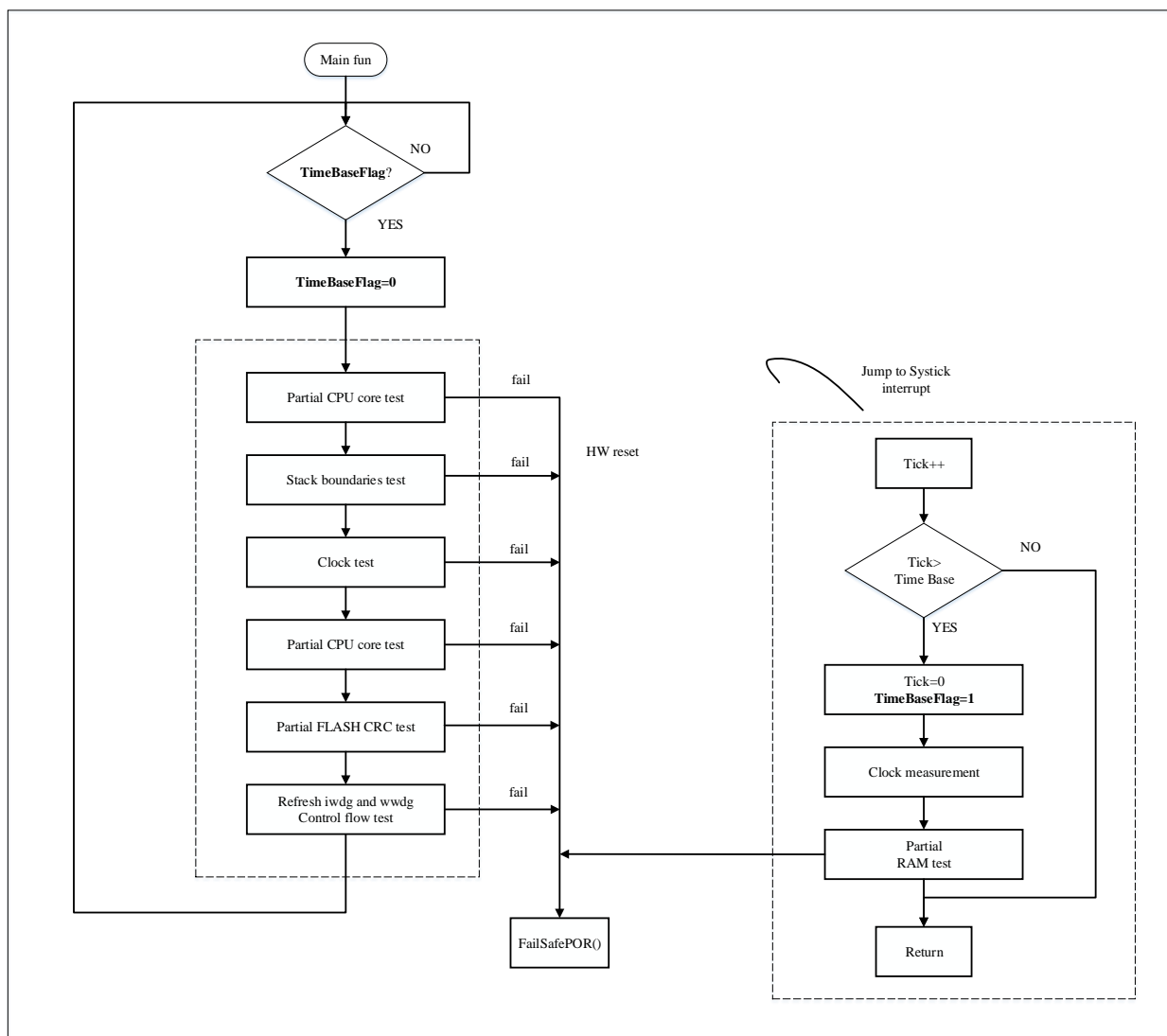
初始化变量 CtrlFlowCnt 为 0，CtrlFlowCntInv 为 0xFFFFFFFF，每测试一个步骤 CtrlFlowCnt 加一个固定值，CtrlFlowCntInv 减同一固定值，启动自检结束时判断两个值相加是否仍为 0xFFFFFFFF。

2.2 运行时检测流程

如果启动时的自检成功通过，运行时的周期自检必须在进入主循环之前进行初始化。

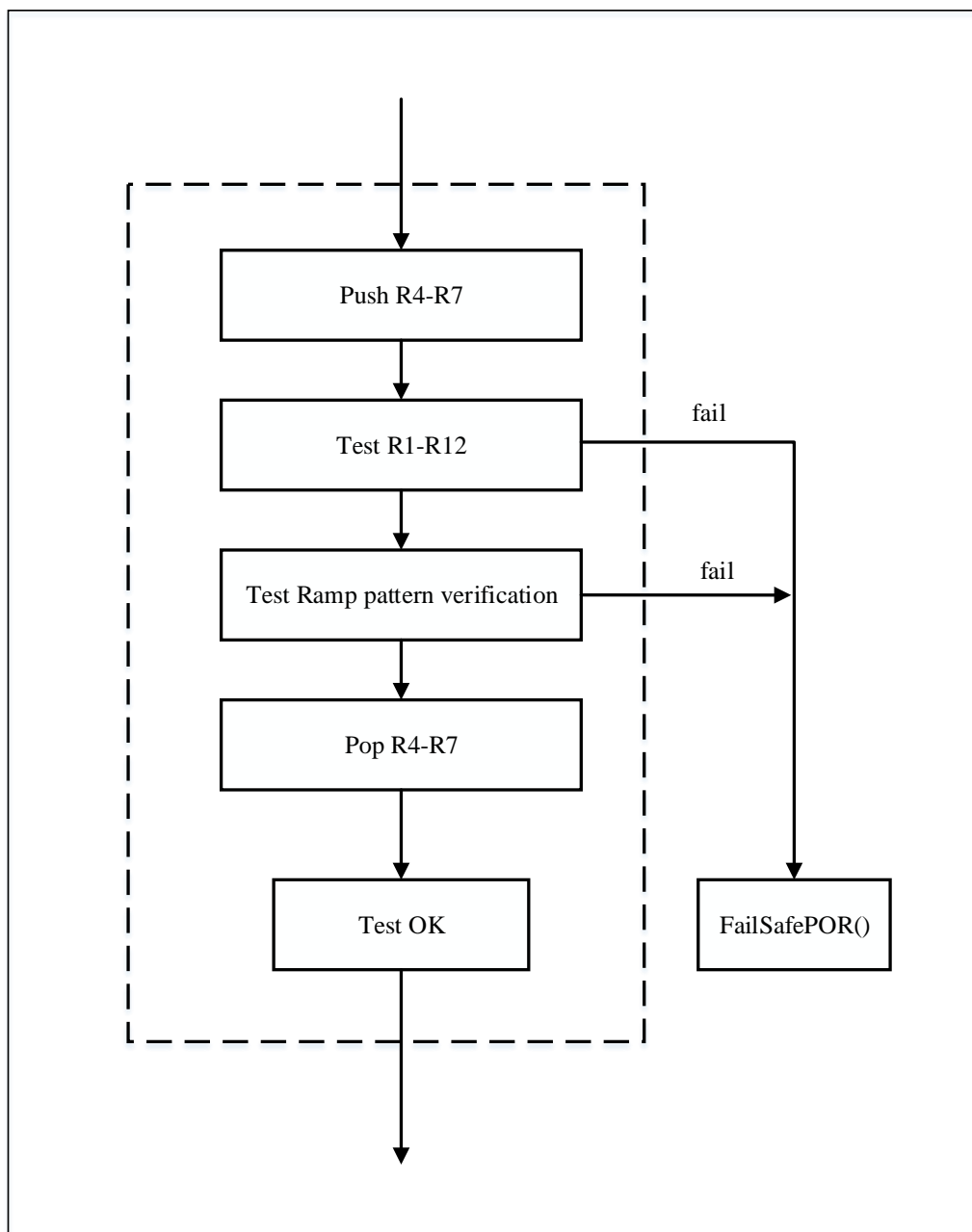
运行时的检测是以 systick 作为时基，进行周期性的检测。

运行时周期检测流程如下：



2.2.1 CPU 运行时检测

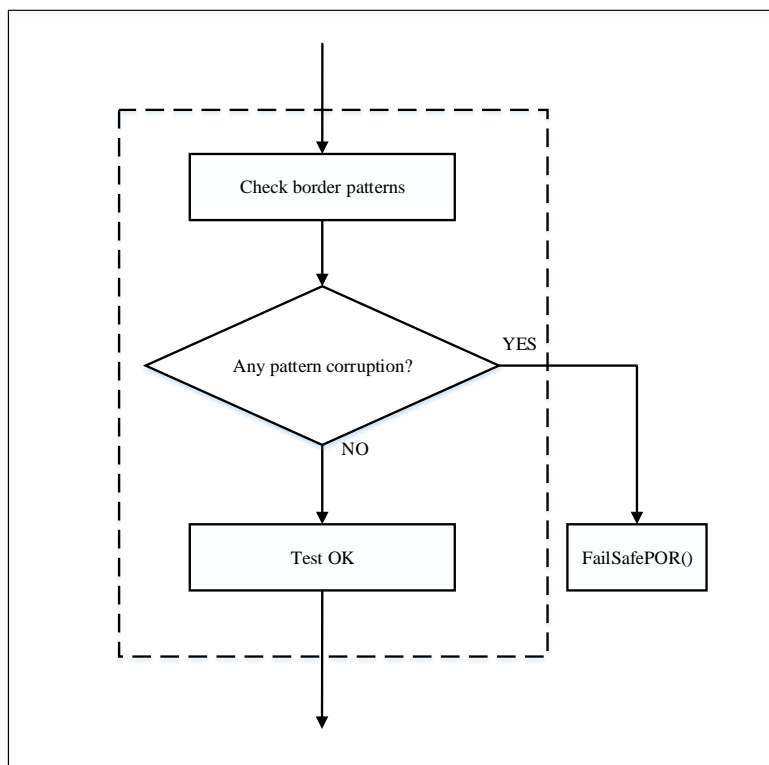
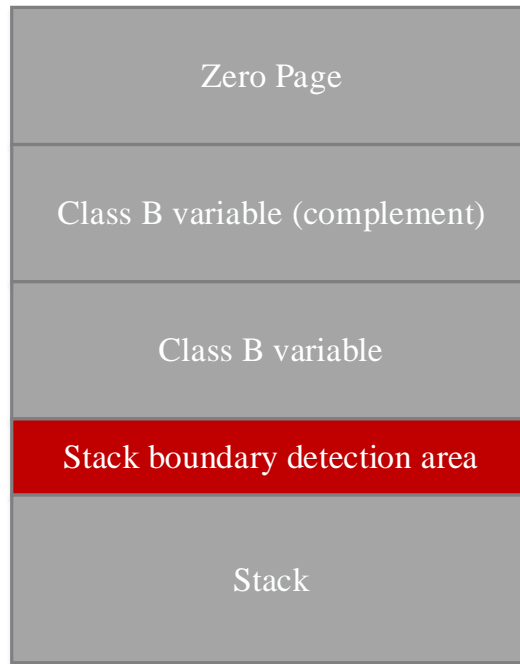
CPU 运行时周期自检跟启动时的自检类似，只是不检测内核标志和堆栈指针。



2.2.2 堆栈边界运行时溢出检测

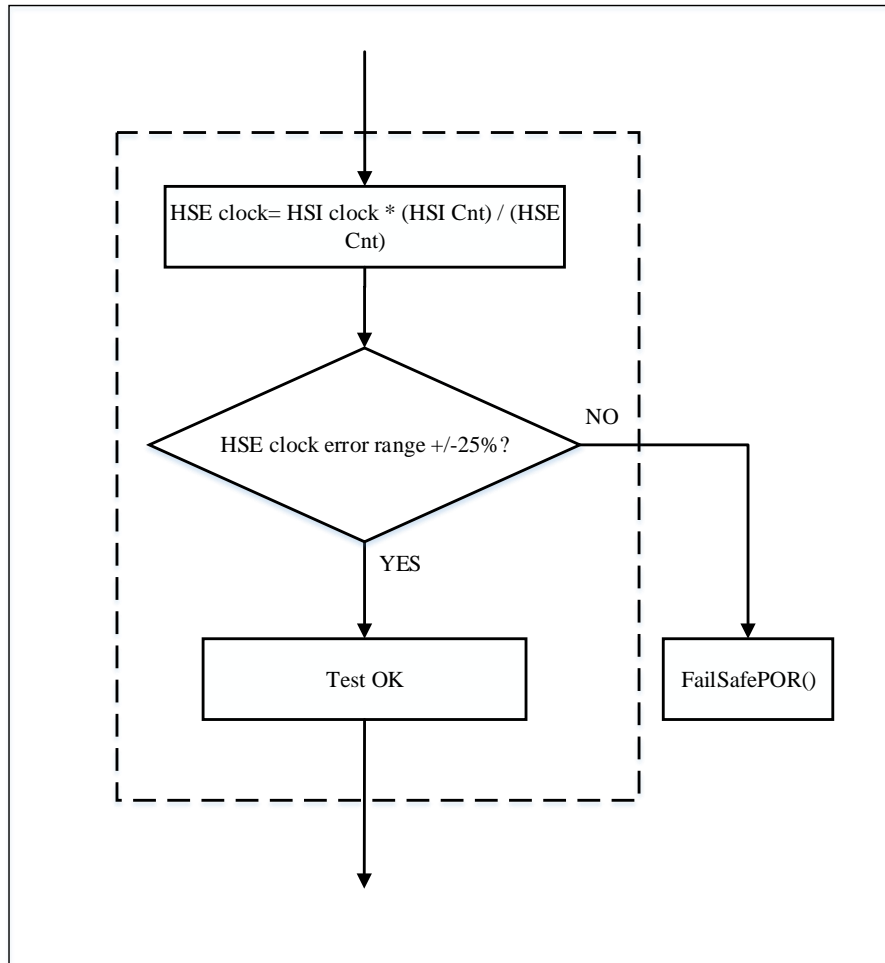
该测试通过判断边界检测区的pattern数组数据完整性来检测堆栈是否溢出。如果原始pattern数据被破坏，则测试失败，调用故障安全程序。

在紧跟堆栈区的低地址位置，定义为堆栈边界检测区。这一区域根据设备可以有不同的配置。用户必须为堆栈定义足够的区域，并保证pattern正确放置。



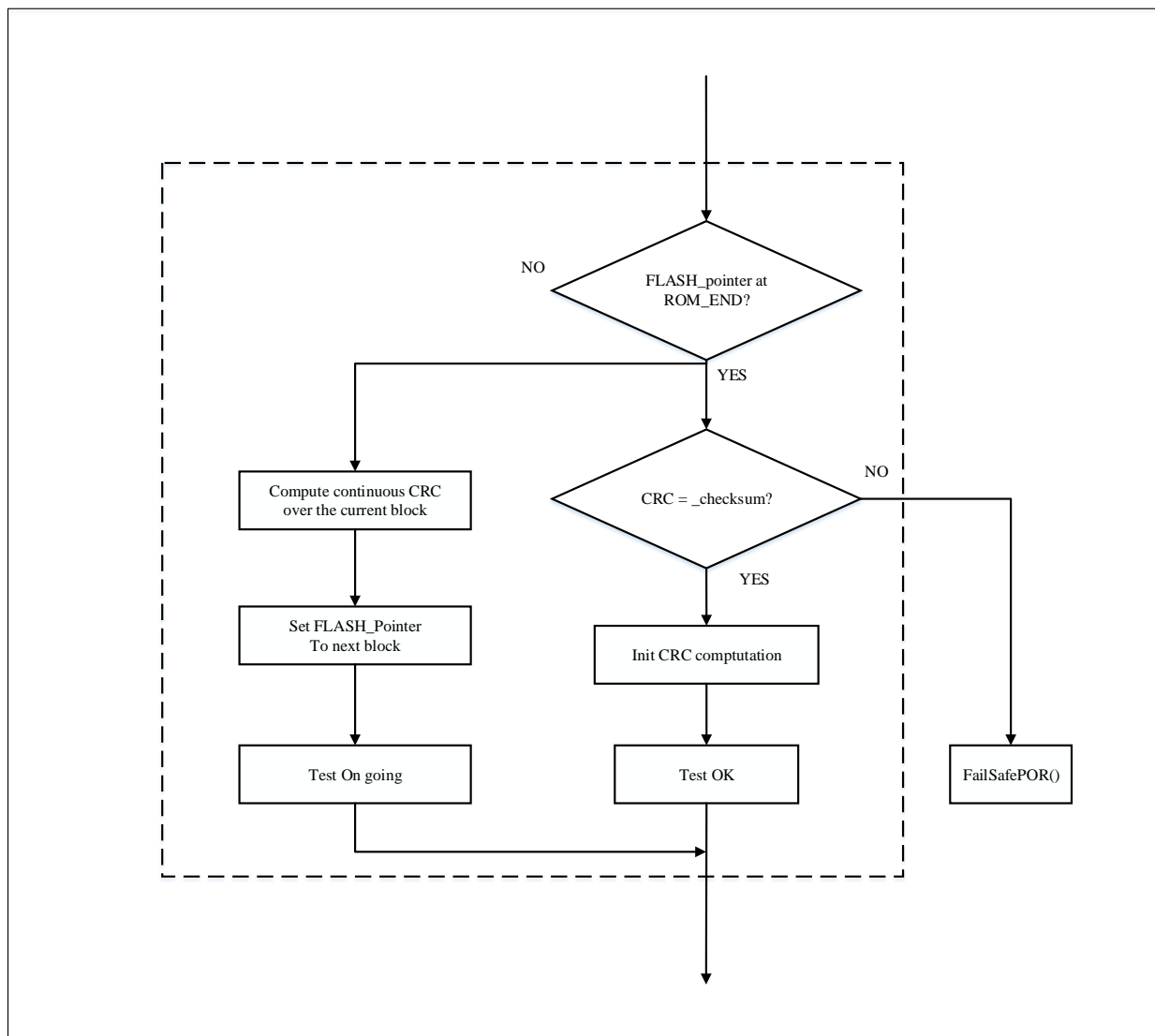
2.2.3 系统时钟运行时检测

运行时系统时钟的检测跟启动时时钟检测类似，通过HSI Cnt及HSE Cnt计算出HSE频率，流程如下：



2.2.4 FLASH 运行时检测

运行时进行Flash CRC的自检，因为检测范围不同耗时不同，可以根据用户应用程序大小配置分段CRC计算，当计算到最后一段范围时，进行CRC值比较，如果不一致则测试失败。



2.2.5 看门狗运行时检测

运行时需要定期喂狗保证系统正常运行，看门狗喂狗的部分放置在 STL_DoRunTimeChecks()最后部分。

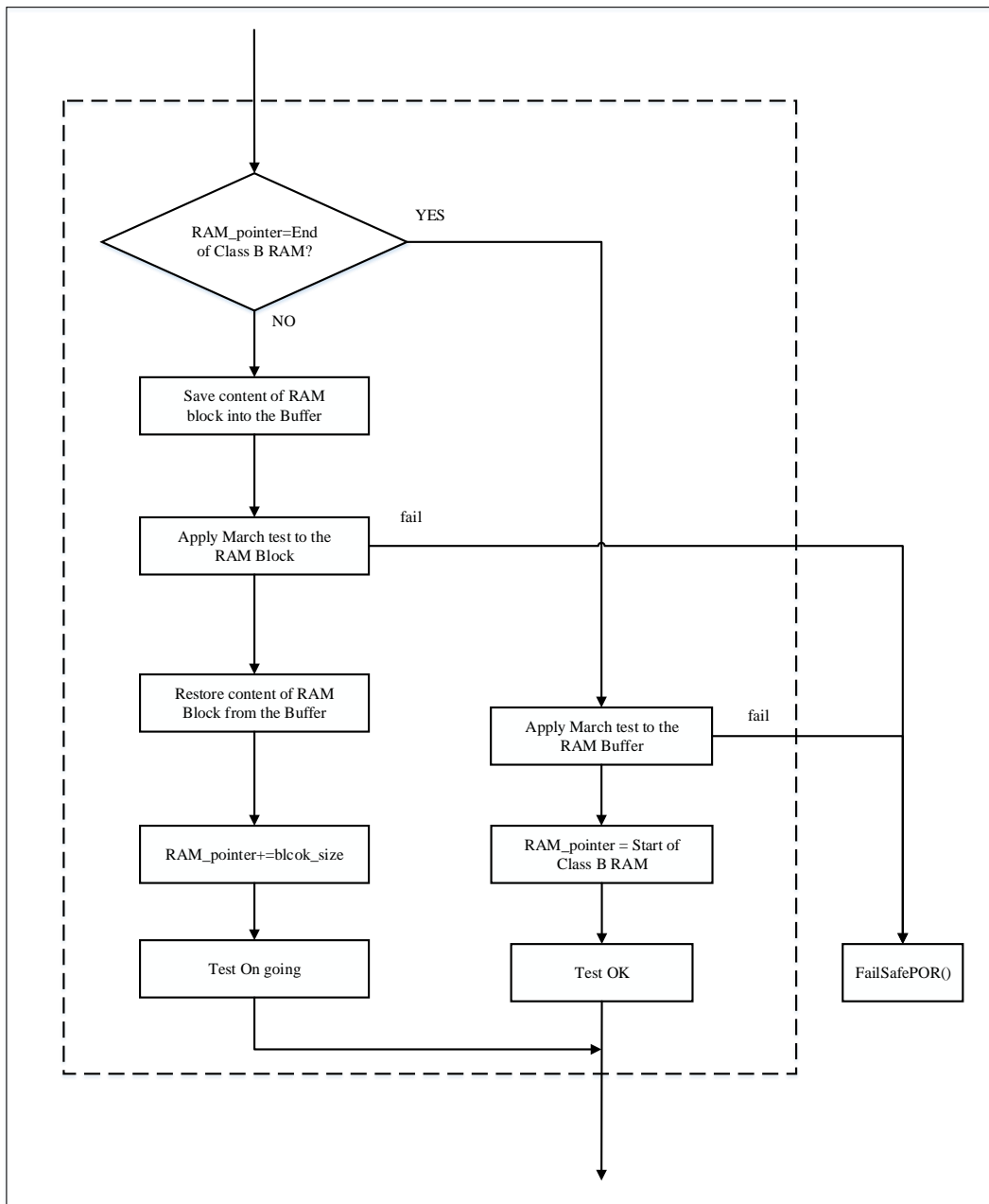
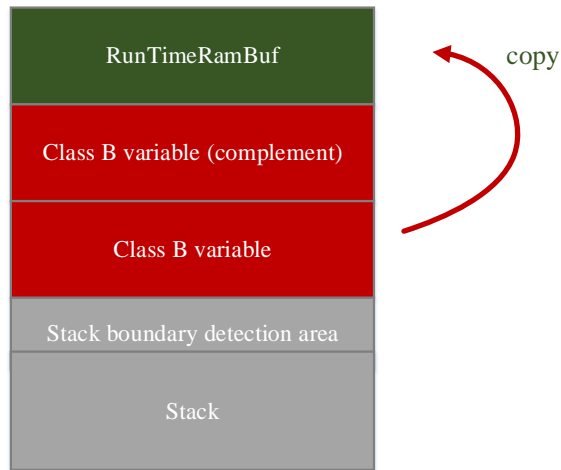
2.2.6 局部 RAM 运行时自检

运行时的RAM自检是在systick中断函数中进行的。测试只覆盖分配给class B变量的那部分内存。

根据class B变量划分的区域，每6字节为一个块，进行March-C测试前将块数据保存在RunTimeRamBuf中，一块测试完成后再将RunTimeRamBuf放回class B区域原位置。直到class B区域全部测试完成。

class B区域测试完成后，对RunTimeRamBuf区域进行March-C测试，测试完成则恢复指针至class B开始地址，开始下一次测试。

注意：RAM检测期间会暂时关闭全局中断，结束后放开中断，因此用户需要注意防止应用代码与RAM检测发生冲突，如I2C模块，需要确认数据收发成后再进行RAM检测。



3. 软件库移植要点

- 在执行用户程序之前，先执行STL_StartUp函数（启动自检）；
- 设置WWDG和IWDG，防止其在程序正常运行时复位；
- 设置启动和运行时的RAM和FLASH检测范围；
 - CRC校验的范围，checksum在Flash中存储的位置
 - ClassB变量的存储地址范围
 - 堆栈边界检测区的位置
- 对检测到的故障进行处理；
- 根据具体的应用，增加用户相关的故障检测内容；
- 根据具体应用定义程序运行时自检的频率；
- 芯片复位后，在执行初始化工作之前，必须先调用STL_StartUp函数进行启动时的自检；
- 在进入main函数主循环前调用STL_InitRunTimeChecks()，主循环中调用STL_DoRunTimeChecks()；
- 用户可以放开Verbose注释进入诊断模式，通过USART1的Tx pin (PA9)脚输出文字信息。

串口配置为115200Bd, no parity, 8-bit data, 1 stop bit;

4. 历史版本

版本	日期	备注
V1.0	2021-12-06	创建文档
V1.1	2025-9-26	1. 2.2.6 章节添加 RAM 检测注意点

5. 声 明

国民技术股份有限公司（下称“国民技术”）对此文档拥有专属产权。依据中华人民共和国的法律、条约以及世界其他法域相适用的管辖，此文档及其中描述的国民技术产品（下称“产品”）为公司所有。

国民技术在此并未授予专利权、著作权、商标权或其他任何知识产权许可。所提到或引用的第三方名称或品牌（如有）仅用作区别之目的。

国民技术保留随时变更、订正、增强、修改和改良此文档的权利，恕不另行通知。请使用者在下单购买前联系国民技术获取此文档的最新版本。

国民技术竭力提供准确可信的资讯，但即便如此，并不推定国民技术对此文档准确性和可靠性承担责任。

使用此文档信息以及生成产品时，使用者应当进行合理的设计、编程并测试其功能性和安全性，国民技术不对任何因使用此文档或本产品而产生的任何直接、间接、意外、特殊、惩罚性或衍生性损害结果承担责任。

国民技术对于产品在系统或设备中的应用效果没有任何故意或保证，如有任何应用在其发生操作不当或故障情况下，有可能致使人员伤亡、人身伤害或严重财产损失，则此类应用被视为“不安全使用”。

不安全使用包括但不限于：外科手术设备、原子能控制仪器、飞机或宇宙飞船仪器、所有类型的安全装置以及其他旨在支持或维持生命的应用。

所有不安全使用的风险应由使用人承担，同时使用人应使国民技术免于因为这类不安全使用而导致被诉、支付费用、发生损害或承担责任时的赔偿。

对于此文档和产品的任何明示、默示之保证，包括但不限于适销性、特定用途适用性和不侵权的保证责任，国民技术可在法律允许范围内进行免责。

未经明确许可，任何人不得以任何理由对此文档的全部或部分进行使用、复制、修改、抄录和传播。